

497413-2026 - Konkursas

Vokietija – Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius) – Dual Beam Focused Ion Beam System (FIB) und Transmissionselektronenmikroskop (TEM)

OJ S 136/2026 17/07/2026

Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka

Prekės

1. Pirkėjas

1.1. Pirkėjas

Oficialus pavadinimas: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

E. paštas: wahl@ifos.uni-kl.de

Pirkėjo teisinė forma: Organizacija, skirianti sutartį, subsidijuojamą perkančiosios organizacijos
Perkančiosios organizacijos veiklos sritis: Švietimas

2. Procedūra

2.1. Procedūra

Pavadinimas: Dual Beam Focused Ion Beam System (FIB) und Transmissionselektronenmikroskop (TEM)

Aprašymas: Los1: DualBeam Focused Ion Beam Systems (FIB) Gegenstand ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Übergabe eines DualBeam Focused Ion Beam Systems (FIB) einschließlich Einweisung/Schulung und vollständiger Systemdokumentation. Die technischen Mindestanforderungen und Bewertungsaspekte ergeben sich aus den Dokumenten "Los1.25-1696.05.techn.Anforderungsprofil" und "Los1.25-1696.06.Wertungsmatrix". Los2: Transmissionselektronenmikroskop (TEM) Gegenstand ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Übergabe eines Transmissionselektronenmikroskops (TEM) einschließlich Einweisung/Schulung und vollständiger Systemdokumentation. Die technischen Mindestanforderungen und Bewertungsaspekte ergeben sich aus den Dokumenten "Los2.25-1707.05.techn.Anforderungsprofil" und "Los2.25-1707.06.Wertungsmatrix".

Procedūros identifikatorius: b3e6743d-bfc2-4cac-a001-90b28790bddb

Vidaus identifikatorius: 25-1696-1707

Pirkimo būdas: Atviras

Procedūra pagreitinta: ne

Pagrindiniai procedūros ypatumai: Die Vergabe erfolgt in zwei Losen (Los 1: FIB, Los 2: TEM). Bieter, die Angebote für beide Lose abgeben, können zusätzlich ein Gesamtangebot (Kombinationsangebot) einreichen. Das Kombinationsangebot muss auf den angebotenen Einzel-Angeboten zu beiden Losen basieren; der Leistungsumfang des Kombinationsangebotes muss den Leistungsumfängen der Angebote auf die Einzellöse entsprechen. Das Kombinationsangebot ist zusätzlich zu den losweisen Angeboten einzureichen und muss: - einen gesonderten Gesamtpreis für beide Lose (unter Berücksichtigung etwaiger Preisvorteile, z. B. Rabatte), sowie - eine Darstellung eines etwaigen losübergreifenden wissenschaftlichen, technischen, funktionalen oder organisatorischen Mehrwerts einer gemeinsamen Präparations- und Analytikplattform enthalten. Etwaige Preisvorteile werden ausschließlich im Zuschlagskriterium "Preis" berücksichtigt. Ein losübergreifender Mehrwert wird ausschließlich im Zuschlagskriterium "Technik" bewertet und setzt voraus, dass dieser über die Bewertung der Einzellöse

hinausgeht und sich aus dem Zusammenwirken beider Systeme ergibt. Die Bewertung der Kombinationsangebote erfolgt nach denselben Zuschlagskriterien. Zusätzlich werden losübergreifende Aspekte wie die vollständige wissenschaftliche Prozesskette einer Probe - von der Präparation im FIB über den qualitätserhaltenden Proben transfer und die korrelative Untersuchung im TEM bis hin zum gemeinsamen Datenmanagement und der nachvollziehbaren Dokumentation der Untersuchungsergebnisse berücksichtigt. Der Auftraggeber behält sich vor, den Zuschlag entweder losweise oder losübergreifend zu erteilen.

2.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Prekės

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 38000000 Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius)

2.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)

Šalis: Vokietija

2.1.4. Bendra informacija

Papildoma informacija: #Bekanntmachungs-ID: CXP4DNMMUBY#

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

vgv -

2.1.5. Pirkimo sąlygos

Pateikimo sąlygos:

Didžiausias pirkimo dalių, dėl kurių vienas dalyvis gali pateikti pasiūlymus, skaičius: 2

Sutarties sąlygos:

Didžiausias pirkimo dalių, dėl kurių vienam dalyviui gali būti skirtos sutartys, skaičius: 2

2.1.6. Pašalinimo pagrindai

Pašalinimo pagrindų šaltiniai: Pranešimas

Įsipareigojimų, nustatytų remiantis išimtinai nacionaliniais pašalinimo pagrindais, pažeidimas:

Dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje:

Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai:

Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas:

Sukčiavimas:

Korupcija:

Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos:

Pareigos mokėti mokesčius pažeidimas:

Pareigos mokėti socialinio draudimo įmokas pažeidimas:

Pareigų aplinkos teisės srityje pažeidimas:

Pareigų socialinės teisės srityje pažeidimas:

Pareigų darbo teisės srityje pažeidimas:

Nemokumas:

Likvidatoriaus administruojamas turtas:

Sustabdyta verslo veikla:

Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus:

Sunkus profesinis nusižengimas:

Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją:

Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje:

Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą:
Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos:
Faktų iškraipymas, nuslėpta informacija, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ar su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas:

5. Pirkimo dalis

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0001

Pavadinimas: Dual Beam Focused Ion Beam System (FIB)

Aprašymas: Ziel dieses Beschaffungsvorhabens ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Übergabe eines Dual-Beam-FIB/REM-Systems (Focused Ion Beam / Rasterelektronenmikroskop) einschließlich analytischer Detektorsysteme, Schulung und vollständiger Systemdokumentation. Das System dient primär der präzisen Probenpräparation (u.a. TEM-Lamellen, APT-Spitzen, Querschnitte und Defektfreilegungen) und sekundär der hochauflösenden bildgebenden, chemischen und strukturellen Charakterisierung (SEM, EDX, STEM, EBSD) im selben System. Das Gerät wird als zentrale Präparations- und Analyseplattform für wissenschaftliche Forschungsprojekte eingesetzt. Typische Anwendungen umfassen u. a. Batterie- und Elektrodenmaterialien, Wasserstoffspeichermaterialien, katalytische Schichten, Metalle/Legierungen, keramische Werkstoffe, Halbleiter, Beschichtungen und Multilayer-Systeme. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf: - reproduzierbarer, möglichst automatisierter TEM-Lamellen- und APT-Präparation (Lift-Out, Thinning, Polishing) - 3D-Analytik (Serienschliff/Tomographie) mit quantitativer Auswertung - hochaufgelöster Abbildung in verschiedenen SEM-Modi incl. Ioneninduzierter Sekundärionen sowie korrelierter Bildgebung während der Bearbeitung - chemischer Analytik mittels EDX und kristallographischer Analytik mittels EBSD Darüber hinaus ist eine strukturierte Erfassung und Exportfähigkeit von Messdaten und Metadaten in gängige, nicht-proprietäre Formate erforderlich, um Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, Langzeitverfügbarkeit und Forschungsdatenmanagement (FAIR-Prinzipien) zu erfüllen. Das System muss die präzise Probenpräparation und -strukturierung mittels Ionenstrahl sowie die begleitende und nachfolgende Abbildung und Analytik mittels SEM und anderen Detektorsystemen ermöglichen. Ziel ist die reproduzierbare Präparation von Proben für TEM und APT sowie die Durchführung von 2D/3D-Analysen (Bildgebung (SE, STEM), EDX, EBSD) einschließlich vollständiger Dokumentation der Bearbeitungs- und Messparameter. Folgende Kernfunktionen sind zwingend bereitzustellen: 1. Materialabtrag/Strukturierung (manuell und automatisiert) mit definierbaren Pattern- und Rezeptfunktionen. 2. TEM-Lamellenpräparation inkl. In-situ Lift-Out, Thinning und abschließender Feinpolitur. 3. APT-Spitzenpräparation (Needle Milling) inkl. reproduzierbarer Geometrie. 4. Korrelierte Echtzeit-Bildgebung im SEM während der FIB-Bearbeitung (Navigation/Endpunktkontrolle). 5. Chemische Analytik mittels EDX sowie kristallographische Analytik mittels EBSD (Punkt, Linie, Mapping). 6. 3D-Workflows (Serienschliff/Tomographie) mit dokumentierter Rekonstruktion bzw. Export der Datensätze. 7. Workflow und Datenmanagement: eindeutige Zuordnung von Bearbeitungs-/Messdaten, Parametern und Metadaten; Export in nicht proprietäre Formate.

Vidaus identifikatorius: 1

5.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Prekės

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 38000000 Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius)

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta

5.1.3. Numatomas galiojimas

Kitas galiojimas: Nežinomas

5.1.6. Bendra informacija

Rezervuota dalyvavimo teisė:

Dalyvavimas nerezervuotas.

Turi būti nurodyti sutarčiai vykdyti paskirtų darbuotojų vardai, pavardės ir profesinė kvalifikacija : Nebūtina nurodyti

Pirkimo projektas, visiškai arba iš dalies finansuojamas iš ES fondų

Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): ne

Šis viešasis pirkimas taip pat tinkamas mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVI): ne

5.1.7. Strateginis viešasis pirkimas

Strateginio viešojo pirkimo tikslas: Strateginių viešųjų pirkimų nėra

5.1.9. Atrankos kriterijai

Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Pranešimas

Kriterijus: Rekomendacijos dėl nurodytų pristatymų

Atrankos kriterijaus aprašymas: Eignungskriterium ist die Vorlage von 3 Referenzen zu vergleichbaren Installationen. Bei Angeboten für ein Los sind Referenzen für vergleichbare Systeme des jeweiligen Loses vorzulegen. Bei Angeboten für beide Lose können Referenzen für beide Systemtypen oder vergleichbare integrierte Systeme eingereicht werden. Als vergleichbare Referenzen gelten erfolgreich durchgeführte Liefer-, Installations- und Inbetriebnahmeprojekte von Systemen, die in Art, Funktion und Komplexität dem jeweils angebotenen Los entsprechen (Los 1: DualBeam FIB bzw. vergleichbare FIB/SEM-Systeme; Los 2: TEM bzw. vergleichbare Elektronenmikroskope). Die Referenzen müssen den vollständigen Leistungsumfang (Lieferung, Installation, Inbetriebnahme, betriebsbereite Übergabe sowie Einweisung) umfassen und in einem wissenschaftlichen oder industriellen High-Tech-Umfeld erbracht worden sein. Sie dürfen zum Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist nicht älter als drei Jahre sein.

5.1.10. Skyrimo kriterijai

Kriterijus:

Rūšis: Kaina

Pavadinimas: Preis (Angebote auf Einzellose und Kombinationsangebote)

Aprašymas: Für das Zuschlagskriterium Preis erhält das Angebot mit dem niedrigsten (gewerteten) Preis 5 Punkte. Null Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem Doppelten des niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises. Alle Angebote mit einem Angebotspreis über dem Doppelten des niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises erhalten ebenfalls null Punkte. Die Punktbewertung für die dazwischenliegenden Angebotspreise erfolgt über eine lineare Interpunktion mit 4 Stellen hinter dem Komma.

Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)

Skyrimo kriterijus: skaičius: 50

Kriterijus:

Rūšis: Kokybė

Pavadinimas: Technik (Angebote auf Einzellose bzw. Kombinationsangebote)

Aprašymas: Für das Zuschlagskriterium Technik werden ausschließlich die nachgewiesenen technischen Leistungsparameter von im Dokument 06.Wertungsmatrix Abschnitt 2 (technische Übererfüllung (wertungsrelevant)) des jeweiligen Loses genannten Anforderungen bewertet.

Das Zuschlagskriterium Technik wird ermittelt, indem die Wertungspunkte der einzelnen Anforderungen jeweils mit dem festgelegten Gewichtungsfaktor gemäß Dokument "06. Wertungsmatrix", Abschnitt 2 ("technische Übererfüllung (wertungsrelevant)") des jeweiligen Loses, multipliziert und anschließend aufsummiert werden. Die technische Bewertung eines Kombinationsangebotes setzt sich aus der technischen Bewertung der beiden Einzellose sowie der Bewertung des zusätzlichen wissenschaftlichen und funktionalen Mehrwerts der gemeinsamen Präparations- und Analytikplattform zusammen. Unterkriterien für diesen Mehrwert sind: K1 durchgängiger Probenworkflow zwischen FIB und TEM K2 Qualität des Probentransfers K3 korrelative Wiederauffindbarkeit identischer Probenbereiche K4 gemeinsames Daten- und Projektmanagement K5 gemeinsames Service- und Betriebskonzept Ergänzend wird auf das Dokument "Gesamt.06.Wertungsmatrix.pdf." Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius) Skyrimo kriterijus: skaičius: 50

5.1.11. Pirkimo dokumentai

Kalbos, kuriomis oficialiai skelbiami pirkimo dokumentai: vokiečių kalba

Papildomos informacijos prašymo terminas: 10/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Pirkimo dokumentų adresas: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY/documents>

Ad hoc ryšių kanalas:

URL: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY>

5.1.12. Pirkimo sąlygos

Pateikimo sąlygos:

Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Privalomos

Pateikimo adresas: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY>

Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: vokiečių kalba

Elektroninis katalogas: Draudžiamos

Alternatyvūs pasiūlymai: Draudžiamos

Dalyviai gali pateikti daugiau kaip vieną pasiūlymą: Neprivalomos

Pasiūlymų priėmimo terminas: 17/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Laikotarpis, per kurį pasiūlymas turi išlikti galiojantis: 77 Dienos

Informacija, kurią galima papildyti po pateikimo termino:

Pirkėjo nuožiūra, visi trūkstami su konkurso dalyviais susiję dokumentai gali būti pateikti vėliau.

Papildoma informacija: Die Vergabestelle behält sich vor, fehlende Angaben und Erklärungen nachzufordern. Ein Anspruch der Bieter besteht nicht (§ 56 VgV). Angebote, die nicht die geforderten oder gegebenenfalls nachgeforderten Erklärungen und Nachweise enthalten, werden nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV ausgeschlossen.

Sutarties sąlygos:

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Ne

Elektroninės sąskaitos faktūros: Neprivalomos

Bus naudojami elektroniniai užsakymai: ne

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: ne

5.1.15. Metodai

Preliminarioji sutartis:

Preliminariosios sutarties nėra

Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą:

Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra

Peržiūros organizacija: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima

Informacija apie peržiūros terminus: Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. Der Antrag ist unzulässig, soweit - der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.

Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0002

Pavadinimas: Transmissionselektronenmikroskop (TEM)

Aprašymas: Gegenstand des Beschaffungsvorhabens ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Übergabe eines aberrationskorrigierten 200 kV Transmissionselektronenmikroskops (S/TEM) einschließlich analytischer Detektorsysteme, Schulung und vollständiger Systemdokumentation. Das System dient als zentrale Analyseplattform für die hochauflösende strukturelle, chemische und elektronische Charakterisierung von Materialien auf atomarer und nanometergenauer Skala. Es wird sowohl für industrielle Auftragsanalytik als auch für wissenschaftliche Forschungsprojekte eingesetzt. Im Institut werden Materialien mit stark variierenden Eigenschaften untersucht, insbesondere Metalle, Legierungen, keramische Werkstoffe, Halbleiter, Beschichtungen, funktionale Schichtsysteme sowie nanostrukturierte Materialien. Die Proben unterscheiden sich hinsichtlich Geometrie, Stabilität gegenüber Elektronenstrahlbelastung sowie analytischer Fragestellungen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf: - hochauflösender Abbildung bis in den atomaren Bereich - chemischer Analytik mittels EDX und EELS - Untersuchung von Grenzflächen und Defekten - Untersuchung magnetischer und funktionaler Materialien - reproduzierbaren Messungen über Probenserien hinweg Darüber hinaus ist eine strukturierte Erfassung und Exportfähigkeit von Messdaten und Metadaten in gängige, nicht-proprietäre Formate erforderlich, um Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, Langzeitverfügbarkeit und Forschungsdatenmanagement (FAIR-Prinzipien) zu erfüllen. Das System muss die hochauflösende strukturelle, chemische und elektronische Analyse von festen, elektronenstrahlstabilen Proben im Transmissionselektronenmikroskopie- und Raster-Transmissionselektronenmikroskopie-Modus ermöglichen. Hierzu muss es eine präzise Elektronenoptik, stabile Betriebsbedingungen sowie integrierte analytische Detektionssysteme

bereitstellen. Ziel ist die Untersuchung von Materialien bis in den atomaren Maßstab sowie die quantitative und qualitative Analyse von Struktur, Zusammensetzung und elektronischen Eigenschaften. Folgende Kernfunktionen sind zwingend bereitzustellen: 1. Hochauflösende Abbildung (TEM und STEM): - Abbildung von Kristallstrukturen, Defekten, Grenzflächen und Nanostrukturen mit atomarer bzw. sub-nanometergenauer Auflösung. - Betrieb sowohl im konventionellen TEM- als auch im STEM-Modus. - Flexible Wahl geeigneter Abbildungsmodi (z. B. Bright Field, Dark Field, HAADF, ABF, Oberflächenbildgebung mit topografieabhängigem Kontrast). 2. Chemische und spektroskopische Analytik: - Elementanalytik mittels energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDX). - Analyse elektronischer und chemischer Zustände mittels Elektronenenergieverlustspektroskopie (EELS). - Durchführung von Punktanalysen, Linienprofilen sowie zweidimensionalem Mapping. 3. Untersuchung von Grenzflächen und Defekten: - Analyse von Phasengrenzen, Ausscheidungen, Korngrenzen und strukturellen Inhomogenitäten. - Untersuchung lokaler chemischer Variationen auf nanoskaliger Ebene. 4. Untersuchung funktionaler und magnetischer Materialien: - Möglichkeit zur magnetfeldfreien oder feldarmen Abbildung (z. B. Lorentz-Modus oder funktional gleichwertig), soweit erforderlich. 5. Automatisierter und reproduzierbarer Betrieb: - Reproduzierbare Einstellung von Messparametern und Speicherung von Messabläufen. - Unterstützung automatisierter Messreihen und Mapping-Experimente. 6. Workflow und Datenmanagement: - Eindeutige Zuordnung von Messdaten, Parametern und Metadaten. - Möglichkeit zur späteren Reproduktion von Messbedingungen. 7. Integration aller Detektoren und Betriebsmodi in eine konsistente Bedienumgebung. Vidaus identifikatorius: 2

5.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Prekės

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 38000000 Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius)

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)

Šalis: Vokietija

5.1.3. Numatomas galiojimas

Kitas galiojimas: Nežinomas

5.1.6. Bendra informacija

Rezervuota dalyvavimo teisė:

Dalyvavimas nerezervuotas.

Turi būti nurodyti sutarčiai vykdyti paskirtų darbuotojų vardai, pavardės ir profesinė kvalifikacija : Nebūtina nurodyti

Pirkimo projektas, visiškai arba iš dalies finansuojamas iš ES fondų

Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): ne

Šis viešasis pirkimas taip pat tinkamas mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ): ne

5.1.7. Strateginis viešasis pirkimas

Strateginio viešojo pirkimo tikslas: Strateginių viešųjų pirkimų nėra

5.1.9. Atrankos kriterijai

Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Pranešimas

Kriterijus: Rekomendacijos dėl nurodytų pristatymų

Atrankos kriterijaus aprašymas: Eignungskriterium ist die Vorlage von 3 Referenzen zu vergleichbaren Installationen. Bei Angeboten für ein Los sind Referenzen für vergleichbare

Systeme des jeweiligen Loses vorzulegen. Bei Angeboten für beide Lose können Referenzen für beide Systemtypen oder vergleichbare integrierte Systeme eingereicht werden. Als vergleichbare Referenzen gelten erfolgreich durchgeführte Liefer-, Installations- und Inbetriebnahmeprojekte von Systemen, die in Art, Funktion und Komplexität dem jeweils angebotenen Los entsprechen (Los 1: DualBeam FIB bzw. vergleichbare FIB/SEM-Systeme; Los 2: TEM bzw. vergleichbare Elektronenmikroskope). Die Referenzen müssen den vollständigen Leistungsumfang (Lieferung, Installation, Inbetriebnahme, betriebsbereite Übergabe sowie Einweisung) umfassen und in einem wissenschaftlichen oder industriellen High-Tech-Umfeld erbracht worden sein. Sie dürfen zum Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist nicht älter als drei Jahre sein.

5.1.10. Skyrimo kriterijai

Kriterijus:

Rūšis: Kaina

Pavadinimas: Preis (Angebote auf Einzellose und Kombinationsangebote)

Aprašymas: Für das Zuschlagskriterium Preis erhält das Angebot mit dem niedrigsten (gewerteten) Preis 5 Punkte. Null Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem Doppelten des niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises. Alle Angebote mit einem Angebotspreis über dem Doppelten des niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises erhalten ebenfalls null Punkte. Die Punktebewertung für die dazwischenliegenden Angebotspreise erfolgt über eine lineare Interpunktion mit 4 Stellen hinter dem Komma.

Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)

Skyrimo kriterijus: skaičius: 50

Kriterijus:

Rūšis: Kokybė

Pavadinimas: Technik (Angebote auf Einzellose bzw. Kombinationsangebote)

Aprašymas: Für das Zuschlagskriterium Technik werden ausschließlich die nachgewiesenen technischen Leistungsparameter von im Dokument 06.Wertungsmatrix Abschnitt 2 (technische Übererfüllung (wertungsrelevant)) des jeweiligen Loses genannten Anforderungen bewertet.

Das Zuschlagskriterium Technik wird ermittelt, indem die Wertungspunkte der einzelnen Anforderungen jeweils mit dem festgelegten Gewichtungsfaktor gemäß Dokument "06.

Wertungsmatrix", Abschnitt 2 ("technische Übererfüllung (wertungsrelevant)") des jeweiligen Loses, multipliziert und anschließend aufsummiert werden. Die technische Bewertung eines

Kombinationsangebotes setzt sich aus der technischen Bewertung der beiden Einzellose sowie der Bewertung des zusätzlichen wissenschaftlichen und funktionalen Mehrwerts der gemeinsamen Präparations- und Analytikplattform zusammen. Unterkriterien für diesen

Mehrwert sind: K1 durchgängiger Probenworkflow zwischen FIB und TEM K2 Qualität des Probentransfers K3 korrelative Wiederauffindbarkeit identischer Probenbereiche K4

gemeinsames Daten- und Projektmanagement K5 gemeinsames Service- und

Betriebskonzept Ergänzend wird auf das Dokument "Gesamt.06.Wertungsmatrix.pdf."

Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)

Skyrimo kriterijus: skaičius: 50

5.1.11. Pirkimo dokumentai

Kalbos, kuriomis oficialiai skelbiami pirkimo dokumentai: vokiečių kalba

Papildomos informacijos prašymo terminas: 10/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Pirkimo dokumentų adresas: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY/documents>

Ad hoc ryšių kanalas:

URL: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY>

5.1.12. Pirkimo sąlygos

Pateikimo sąlygos:

Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Privalomos

Pateikimo adresas: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY>

Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: vokiečių kalba

Elektroninis katalogas: Draudžiamos

Alternatyvūs pasiūlymai: Draudžiamos

Dalyviai gali pateikti daugiau kaip vieną pasiūlymą: Neprivalomos

Pasiūlymų priėmimo terminas: 17/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Laikotarpis, per kurį pasiūlymas turi išlikti galiojantis: 77 Dienos

Informacija, kurią galima papildyti po pateikimo termino:

Pirkėjo nuožiūra, visi trūkstami su konkurso dalyviais susiję dokumentai gali būti pateikti vėliau.

Papildoma informacija: Die Vergabestelle behält sich vor, fehlende Angaben und Erklärungen nachzufordern. Ein Anspruch der Bieter besteht nicht (§ 56 VgV). Angebote, die nicht die geforderten oder gegebenenfalls nachgeforderten Erklärungen und Nachweise enthalten, werden nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV ausgeschlossen.

Sutarties sąlygos:

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Ne

Elektroninės sąskaitos faktūros: Neprivalomos

Bus naudojami elektroniniai užsakymai: ne

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: ne

5.1.15. Metodai

Preliminarioji sutartis:

Preliminariosios sutarties nėra

Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą:

Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra

Peržiūros organizacija: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima

Informacija apie peržiūros terminus: Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. Der Antrag ist unzulässig, soweit - der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,

einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.

Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

8. Organizacijos

8.1. ORG-0001

Oficialus pavadinimas: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

Registracijos numeris: UStID DE148647541

Pašto adresas: Trippstadter Straße 120

Miestas: Kaiserslautern

Pašto kodas: 67663

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)

Šalis: Vokietija

E. paštas: wahl@ifos.uni-kl.de

Telefono numeris: +49 631205730

Šios organizacijos vaidmenys:

Pirkėjas

Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą

Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus

8.1. ORG-0002

Oficialus pavadinimas: eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft rechtsanwaltsgesellschaft

Registracijos numeris: UStID DE267215971

Pašto adresas: Kramergasse 4

Miestas: Dresden

Pašto kodas: 01067

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)

Šalis: Vokietija

E. paštas: l.moerchen@eureos.de

Telefono numeris: +49 39156286912

Šios organizacijos vaidmenys:

Pirkimo paslaugų teikėjas

8.1. ORG-0003

Oficialus pavadinimas: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima

Registracijos numeris: 07-0001801100000-05

Pašto adresas: Stiftsstraße 9

Miestas: Mainz

Pašto kodas: 55116

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Mainz, Kreisfreie Stadt (DEB35)

Šalis: Vokietija

E. paštas: vergabekammer.rlp@mwvlw.rlp.de

Telefono numeris: +49 6131162234

Šios organizacijos vaidmenys:

Peržiūros organizacija

8.1. ORG-0004

Oficialus pavadinimas: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registracijos numeris: 0204:994-DOEVD-83

Miestas: Bonn

Pašto kodas: 53119

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Šalis: Vokietija

E. paštas: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefono numeris: +49228996100

Šios organizacijos vaidmenys:

TED eSender

Skelbimo informacija

Skelbimo identifikatorius / versija: c6abad07-e17d-4e42-b1fc-35d01bf3fcf6 - 01

Formos tipas: Konkursas

Skelbimo rūšis: Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka

Skelbimo porūšis: 16

Skelbimo išsiuntimo data: 15/07/2026 17:22:32 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Kalbos, kuriomis šis skelbimas oficialiai skelbiamas: vokiečių kalba

Skelbimo paskelbimo numeris: 497413-2026

OL S numeris: 136/2026

Paskelbimo data: 17/07/2026